07

Эффект аномального обратного рассеяния мощного лазерного излучения плоской поверхностью твердого тела

© А.Ю. Иванов

Институт аналитического приборостроения РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 26 марта 1999 г.

Описываются результаты измерения характеристик обратного рассеяния мощного лазерного излучения на плоских случайно-шероховатых поверхностях различных материалов в широком диапазоне параметров как излучения, так и поверхности. Обнаружено, что в диапазоне интенсивностей зондирующего излучения $\sim 10^3-10^7~{\rm W/cm^2}$ при длительности его импульса $\sim 10^{-8}~{\rm s}$ при ряде дополнительных условий картина рассеяния становится аномальной. Проведенный анализ результатов соответствует законам структурной обусловленности, границы качества, аномальности и чередования неравновесности. Обсуждаются возможные практические применения обнаруженного эффекта.

В последнее время все актуальнее становится задача исследования процессов взаимодействия мощного лазерного излучения с поверхностью твердого тела. Определение свойств поверхности важно при измерении деформаций, для контроля шероховатости поверхности при обработке материалов, для контроля качества лазерной оптики (например, резонаторных зеркал, кристаллов, дисперсионных элементов и пр.), в нелинейной оптике, в лазерной локации, в микроинтерферометрии, в эллипсометрии и пр.

Для исследования характеристик рассеяния света плоскими изотропными обработанными шероховатыми поверхностями различных материалов была создана универсальная экспериментальная установка [1,2], которая позволяла оперативно исследовать самые разнообразные характеристики обратного рассеяния излучения в весьма широком динамическом диапазоне с высокой точностью.

На этой установке было проведено большое количество измерений амплитудных, поляризационных, временных и спектральных характеристик рассеяния образцов. Измерения проводились с различными источ-

никами излучения, как когерентными, так и нет, как непрерывными, так и импульсными (с малой длительностью импульса $\sim 10^{-8}\,\mathrm{s}$ при большой скважности $\sim 10^6$), при различных состояниях поляризации в падающей волне, на разных длинах волн, при различных размерах и ориентации облучаемой площадки образца, в диапазоне интенсивностей $\sim 10^{-3}-10^9\,\mathrm{W/cm^2}$. что соответствует мощности излучения $\sim 10^{-3}-10^6\,\mathrm{W}$. При этом облучение исследуемой поверхности проводилось узким параллельным пучком света с малой угловой расходимостью $\sim 10^{-3}\,\mathrm{rad}$. Прием рассеянного излучения проводился также в малом телесном угле $\sim 10^{-4}\,\mathrm{rad}$. При этом угол рассеяния изменялся с помощью поворота исследуемого образца, т. е. угол рассеяния был равен углу падения, а угол между направлениями облучения и наблюдения был фиксирован и мал: $\sim 2.5^\circ$.

Снимались угловые зависимости коэффициента яркости $\beta(\varphi)$ и отражения $\rho(\varphi)$ и элементов поляризационной матрицы Мюллера $[B_{ik}]$ ранга 2×2 поверхности образцов и угловая зависимость длительности рассеянного импульса $\tau(\varphi)$. Исследовались самые разнообразные материалы различной структуры: как металлы, так и нет, с различными покрытиями и различной глубиной проникновения излучения в среду в диапазоне шероховатостей $R_z=10^{-3}-10^2~\mu\mathrm{m}$ в спектральном диапазоне $\lambda=0.26-1.1~\mu\mathrm{m}$.

Выяснилось, что характеристики обратного рассеяния света в диапазоне интенсивностей $10^{-3}-10^3~\rm W/cm^2$ и шероховатостей $10^{-3}-10^2~\rm \mu m$ и в непрерывном, и в импульсном режимах облучения дают известную картину с диффузной, зеркальной и зеркально-диффузной индикатрисами рассеяния, вполне удовлетворительно описываемую классическими теориями рассеяния Френеля и Рэлея—Райса [3,4].

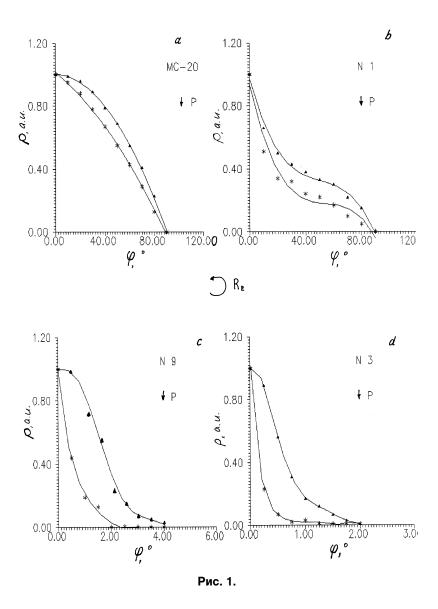
В диапазоне интенсивностей $10^7 - 10^{10} \, \mathrm{W/cm^2}$ взаимодействие излучения с поверхностью твердого тела носит ярко выраженный нелинейный характер. При этом возбуждаются процессы, ведущие, как правило, к необратимым термическим деформациям исследуемой поверхности, например оптический пробой, локальный пробой на микронеоднородностях поверхностной структуры, термодинамические деформации поверхности, ее плавление и испарение, резка, полировка и т. д. При этом характеристики рассеяния, естественно, изменяются по сравнению с предыдущим случаем. Эти процессы также достаточно хорошо описываются известными теориями нелинейной оптики [5-7].

На ряде поверхностей определенных материалов могут происходить некогерентные и нелинейные процессы излучения поверхностных объемных частиц (флюоресценция, рамановское рассеяние, генерация гармоник и параметрическое преобразование частоты, фотоионизация, разного рода фотохимические и оптоакустические процессы и пр.). Эти процессы также могут вести к изменению характеристик рассеяния света по сравнению с классическим случаем и также достаточно хорошо описываются известными оптическими теориями [8–10]. Однако такие процессы, как правило, носят ярко выраженный резонансный характер и могут происходить только на строго определенных материалах.

В то же время при использовании когерентных источников излучения (лазеров) с малой длительностью импульса $\sim 10^{-8}$ s, которая сравнима с характерными структурными временами атомно-молекулярных процессов, и интенсивностью $\sim 10^3 - 10^7 \, \text{W/cm}^2$, т.е. при увеличении степени неравновесности [11] системы "излучение-поверхность", возникает необычная картина рассеяния. Индикатрисы обратного рассеяния вытягиваются вдоль направления зеркального отражения (рис. 1), и появляются характерные зависимости длительности импульса рассеянного излучения (увеличение в максимуме до 10 раз по сравнению с длительностью падающего излучения) от угла рассеяния с максимумом $\sim 45^{\circ}$, величина которого обратно пропорциональна R_z (рис. 2). Кроме того, спектральная зависимость $\beta(\varphi)$, $\rho(\varphi)$ и $[B_{ik}](\varphi)$ меняется по сравнению с классическим случаем ($\rho \sim \lambda^{-2}$) на прямо противоположную $(
ho \sim \lambda^2)$ (рис. 3). Эти особенности обратно пропорциональны средней шероховатости R_z и увеличиваются с мощностью падающего излучения P_0 следующим образом: угловая ширина индикатрисы $\Delta arphi \sim P_0^{-1/2}$ (рис. 4), а длительность рассеянного импульса $au_0 \sim P_0^{+1/2}$, причем увеличение может составлять 2 порядка.

На рис. 1–4 приведены экспериментальные данные для типичных зеркальных (образцы N 3,9), зеркально-диффузного (образец N 1) и диффузного (образец "молочное стекло MC-20") образцов. Стрелками указаны направления роста соседней шероховатости поверхности исследуемого образца R_z и мощность импульса падающего лазерного излучения P_0 . При этом интегральные выражения

$$\frac{\left(\iint \rho(\varphi) d\varphi dt\right)^{P>10^{3} \,\mathrm{W}}}{\left(\iint \rho(\varphi) d\varphi dt\right)^{P<10^{3} \,\mathrm{W}}} \cong \frac{\left(\Delta \varphi \Delta \tau\right)^{P>}}{\left(\Delta \varphi \Delta \tau\right)^{P<}} \cong \frac{\left(\Delta \varphi \rho(0)\right)^{P>}}{\left(\Delta \varphi \rho(0)\right)^{P<}} \cong 1 \tag{1}$$



Письма в ЖТФ, 1999, том 25, вып. 16

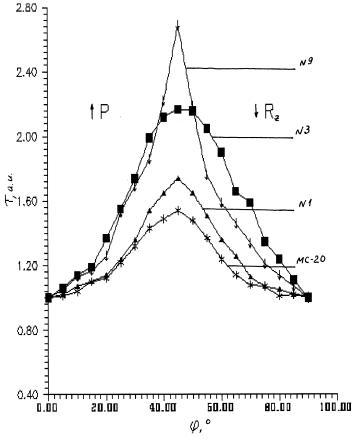
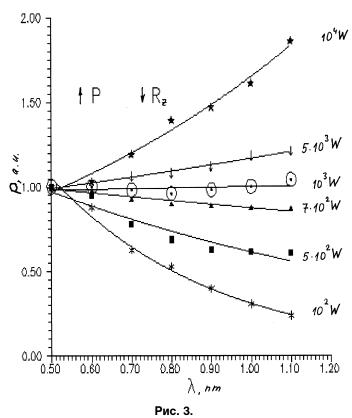


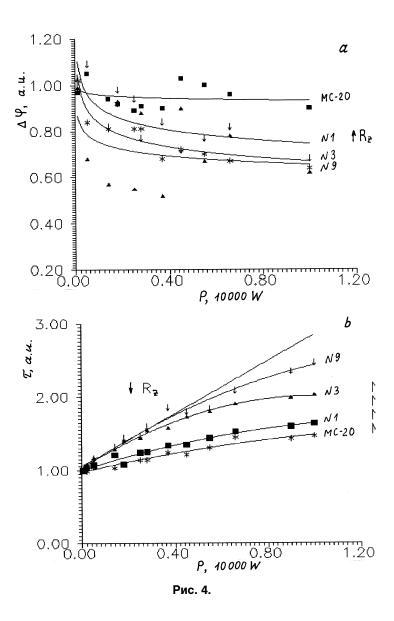
Рис. 2.

оказались инвариантами относительно изменения параметров как падающего излучения, так и поверхности. Это подтвердилось и дополнительным экспериментом по измерению интегральных абсолютных коэффициентов отражения исследуемых поверхностей, определяемых как

$$\rho_0 = \int_0^\infty dt \int_0^\pi \rho(\varphi) d\varphi. \tag{2}$$



Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при увеличении степени неравновесности системы "падающее излучение—поверхность", а именно при увеличении интенсивности падающего излучения и уменьшении длительности его импульса, т.е. при приближении этих величин к некоторым структурным критическим константам ($\tau_0 \to \tau_s^c$, $P_0 \to P_0^c$), пространственно-временные характеристики излучения, рассеянного плоской изотропной шероховатой поверхностью твердого тела, существенно меняются. При этом никаких изменений полной энергии пучка рассеянного излучения не происходит. Проис-



3* Письма в ЖТФ, 1999, том 25, вып. 16

ходит лишь перекачка энергии из диффузной компоненты рассеянного излучения в зеркальную, причем этот процесс идет с некоторой задержкой во времени, которая зависит от угла падения и направления поляризации в падающей волне, длины волны и интенсивности падающего лазерного излучения, с одной стороны, и характеристик облучаемой поверхности, с другой стороны. Этот процесс упругий, обратимый и не зависит от размеров и ориентации облучаемого участка поверхности. При этом никаких нелинейных и некогерентных процессов на поверхности, характерных для больших интенсивностей лазерного излучения $I \sim 10^7 - 10^{10} \, \text{W/cm}^2$, не происходит. В то же время полученную аномальную картину рассеяния в рамках классических теорий рассеяния Френеля и Рэлея—Райса, хорошо работающих в диапазоне интенсивностей $I < 10^3 \, \text{W/cm}^2$, объяснить невозможно.

Таким образом, обнаружено некоторое окно-эффект, для которого, начиная с некоторой границы качества $\lambda \to \lambda_s~(R_z/\lambda \to \lambda/10)~[11],$ $\tau_0 \to \tau_s \sim 10^{-8}\,\mathrm{s}~[12]$ и $\varepsilon_0 \to \varepsilon_s~(I_0 \to I_c = 10^3 - 10^7\,\mathrm{W/cm^2}),$ процесс поверхностного рассеяния лазерного излучения носит аномальный характер. Это соответствует законам границы качества, аномальности и чередования неравновесности [11,12]. Наиболее разумное физическое объяснение обнаруженного эффекта можно дать на основании теории 3-волнового взаимодействия рассеянной волны с падающей и инициируемой самой падающей волной так называемой поверхностной электромагнитной волной (ПЭВ) в процессе динамической обратимой структурной перестройки исследуемой поверхности под действием мощного лазерного излучения [13–16], что соответствует закону структурной обусловленности [17].

Следуя этой теории, нижние границы качества ε_s и τ_s можно определить исходя из условия оптимума обратимой динамической структурной перестройки исследуемой поверхности под действием мощного импульсного лазерного излучения и максимума амплитуды возникающей при этом ПЭВ. Их можно найти из выражений [18]:

$$\begin{cases} kI_0\tau_0 \geqslant (R_z/\lambda)opt \\ I_0/I_c = 64\pi^2(w_{sp}/\gamma)(h/c\lambda)^2(1-\sin\varphi_{opt}) \geqslant 1, \end{cases}$$
 (3)

где $k\approx 1$, размерная константа, w_{sp} и γ — частота и полуширина возбуждаемых поверхностно-плазмонных резонансов, h и c — константа Планка и скорость света в вакууме.

Верхняя граница качества для интенсивности определяется требованием исключения нелинейных процессов, ведущих к необратимым изменениям исследуемой поверхности типа оптического пробоя и т.д. (см. выше).

Очевидно, что обнаруженный эффект аномального рассеяния нужно учитывать в целом ряде случаев: лазерная локация, контроль качества поверхности при обработке материалов, контроль качества лазерной оптики, в нелинейной оптике, в спектроскопии, в теории взаимодействия света с веществом и пр. Этот же эффект может служить основой для создания новых эффективных технологий, использующих "окна квазиравновесности". Так, для лазерной оптики, согласно этому эффекту, достаточно использовать зеркала с поверхностью значительно худшего качества, чем по френелевскому отражению. С учетом этого обстоятельства был изготовлен мощный твердотельный лазер с глухим зеркалом "плохого качества" и интерференционной стопой, собранной из плоскопараллельных стеклянных пластин, в качестве выходного зеркала [19].

Список литературы

- [1] Весничева Г.А., Иванов А.Ю., Малышев Г.М. // Деп. в ЦНИИТЭИприборостроения. № 4215-Б от 17.05.1988. 10 с.
- [2] Весничева Г.А., Иванов А.Ю., Просужих В.М. // Тез. докл. 2-й Междун. конф. по оптической обработке информации. Фрунзе, 24–26.05.90. С. 153– 154.
- [3] Кизель В.А. Отражение света. М.: Наука, 1973. 502 с.
- [4] Максименко В.В., Крикунов В.И., Лушников А.А. // ЖЭТФ. 1992. Т. 102. № 5. С. 1571–1586.
- [5] Анисимов С.И., Имас Я.А., Романов Т.С., Хадыко Ю.В. Действие излучения большой мощности на металлы. М.: Наука, 1970. 272 с.
- [6] Ковалев А.С., Попов А.М., Пятигорская О.Б. // ЖТФ. 1983. В. 5. С. 939–940.
- [7] Бонч-Бруевич А.М., Имас Я.А., Либенсон М.Н., Шандыбина Г.Д. // Поверхность, 1985. N 5. C. 102–106.
- [8] Бонч-Бруевич А.М., Имас Я.А., Либенсон М.Н., Шандыбина Г.Д. // ИАН СССР. Сер. Физ. 1985. Т. 49. С. 1166–1170.
- [9] *Летохов В.С.* Нелинейные селективные фотопроцессы в атомах и молекулах. М.: Наука, 1988. 408 с.

[10] *Бонч-Бруевич А.М., Диденко И.А., Капорский Л.Н.* // ИАН СССР. Сер. Физ. 1985. Т. 49. № 6. С. 1096–1102.

- [11] Скворцов Г.Е. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 17. С. 15–18.
- [12] Скворцов Г.Е. // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23. В. 6. С. 23–27; В. 7. С. 85–88.
- [13] Андреев А.В., Емельянов В.И., Ильинский Ю.А. Кооперативные явления в оптике. М.: Наука, 1988. 288 с.
- [14] Sheng P. // Scattering of classical waves in random media. Singapoor, 1990. 417 p.
- [15] Кособукин В.В. // ИАН СССР. Сер. Физ. 1985. Т. 49. № 6. С. 1111–1112.
- [16] Maradudin A.A., McGurn A.R. // JOSA. 1987. V. B4. N 6. C.910-926.
- [17] Скворцов Г.Е. // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23. В. 10. С. 17–21.
- [18] *Емельянов В.И.* // Тез. 7-й Всесоюзн. конф. по взаимодействию оптического излучения с веществом. Л., 14–18.03.1988. С. 17–19.
- [19] *Иванов А.Ю.* // Тез. докл. 1-й Междун. конф. "Поиск, изучение и освоение открытий в России". С.-Петербург, 22–23.10.92. С. 49–50.